

полностью отражаются обратно внутрь Н. (см. *Нейтронная оптика*). Начиная с  $r = d(\mathcal{E}/U)^{1/2}$  ( $d$  — попечерные размеры), полное отражение от стенок должно испытывать все нейтроны с энергией  $\mathcal{E} < \mathcal{E}_0$ , и плотность потока таких нейtronов в Н. будет оставаться почти постоянной. Нек-рые потери нейtronов возникают за счёт диффузного отражения от шероховатостей стенок и слабого поглощения в тонком поверхностном слое (толщиной  $\sim 200 \text{ \AA}$ ), соответствующем глубине проникновения нейтрана в стенки при полном отражении. Для тепловых нейtronов с  $\mathcal{E} = 0,025 \text{ эВ}$  и стенок из Ni ( $U = 2 \cdot 10^{-7} \text{ эВ}$ ) макс. угол скольжения  $\alpha = 10^\circ$ . Обычно зеркальные Н. изготавливают из полированных стеклянных пластин с напылённым на поверхность тонким (1—2 мкм) слоем Ni. Пластины склеиваются в Н. коробчатого сечения.

Если зеркальный Н. плавно изогнуть с радиусом изгиба  $R = 2d\mathcal{E}_0/U(d'$  — размер Н. в плоскости изгиба), то он может служить фильтром, пропускающим нейтроны с  $\mathcal{E} < \mathcal{E}_0$ . Кроме того, пучок на выходе изогнутого зеркального Н. свободен от  $\gamma$ -излучения, неизбежно испускаемого нейтронными источниками. Зеркальные Н. используются также и как поляризаторы медленных нейtronов. С этой целью отражающий слой изготавливается из ферромагнетика, для к-рого отталкивающий нейтран потенциал стенок равен  $U' = U \pm \mu B$ , где  $\mu$  — магн. момент нейтрана,  $B$  — индукция магн. поля в ферромагн. слое, знаки  $\pm$  соответствуют двум ориентациям спина нейтрана. В нек-рых материалах (напр., сплав 50% Fe + 50% Co)  $U = |\mu B|$  и полное отражение имеет место только для одной из возможных проекций спина нейтрана (см. *Поляризованные нейтраны*). Ультрахолодные нейтраны ( $\mathcal{E} < U$ ) испытывают полное отражение от стенок Н. при любых углах падения и распространяются по Н. произвольной формы, как сильно разреженный газ.

Лит. см. при ст. *Нейтронная оптика*. В. И. Луцков.

**НЕЙТРОНОГРАФИЯ** — совокупность методов исследования структуры и свойств вещества с помощью рассеяния нейtronов низких энергий ( $\mathcal{E} \leq 1 \text{ эВ}$ ). Длина волны де Броия медленных нейtronов соизмерима с межатомными расстояниями в конденсир. средах, что позволяет изучать взаимное расположение атомов (см. *Нейтронография структурная*). Масса и кинетич. энергия нейтрана соизмеримы с массой атома и энергией межатомных взаимодействий в веществе, что позволяет с помощью *неупругого рассеяния нейtronов* исследовать динамич. свойства отд. атомов и молекул в среде. Магн. момент нейтрана взаимодействует с магн. моментами атомов, что позволяет по интенсивности и поляризации магн. рассеяния определять величины магн. моментов атомов, их взаимное расположение и ориентацию, динамич. свойства (см. *Магнитная нейтронография*). Н. применяется для исследования структурных, динамич. и магн. свойств практически всех известных форм конденсир. состояния вещества, от простых жидкостей и кристаллов до биологических макромолекул.

Рассеяние нейtronов веществом принято классифицировать по след. признакам: по изменению энергии нейтрана при рассеянии (упругое, неупругое); по характеру взаимодействия, ответственного за рассеяние (ядерное, магнитное); по степени когерентности нейtronных волн, рассеянных от множества центров, образующих изучаемое вещество. В общем случае интенсивность нейtronной волны, рассеянной малым объёмом вещества, можно представить в виде двух слагаемых, первое из к-рых пропорц. числу рассеивающих центров  $N$  (некогерентная составляющая), второе —  $N^2$  (когерентная составляющая). Когерентная составляющая проявляется в виде пиков на нейтронограмме, некогерентная определяет фон. Некогерентная составляющая нечувствительна к структуре вещества, отражает взаимодействие нейтрана с отд. рассеивающими центрами (дефектами, примесями) и даёт информацию

только о динамич. свойствах отд. рассеивателей (атомных ядер, магн. моментов, молекул). Когерентная составляющая является структурно-чувствительной и позволяет получать информацию о структуре вещества, коллективных динамич. свойствах.

Отличия Н. от методов, использующих рассеяние др. частиц (электронографии, рентгеновского структурного анализа, рассеяния света), связаны со свойствами нейтрана: отсутствием электрич. заряда, наличием массы покоя и взаимодействием с веществом только посредством ядерных и магн. сил, а также с высокой проникающей способностью нейтрана, возможностью обмениваться со средой значит. частью кинетич. энергии, изотропией амплитуды ядерного рассеяния и её нерегулярной зависимостью от массового числа  $A$  и заряда  $Z$  ядра. Н. является единственным методом, пригодным для исследования нек-рых свойств конденсированных сред, и часто применяется в физике твёрдого тела, жидкостей, физической химии, молекулярной биологии и др.

Нейтронографич. исследования проводятся в научных центрах, располагающих мощными *нейтронными источниками* — исследовательскими ядерными реакторами или ускорителями частиц с мишенью, производящей нейтраны. В СССР такими центрами являются ИАЭ, ОИЯИ (Дубна), ЛИЯФ (Гатчина) и др. Осн. зарубежные центры — Ин-т Лауз — Ланжевена (Гренобль, Франция), Брукхейвенская нац. лаборатория (Нью-Йорк, США), лаборатория Резерфорда — Аплтон (Великобритания) и др.

Лит. см. при ст. *Нейтронография структурная*.

А. М. Балагуров, Ю. М. Останевич.

**НЕЙТРОНОГРАФИЯ СТРУКТУРНАЯ** — исследование атомной структуры конденсир. сред методом дифракции нейtronов низких энергий на атомных ядрах (упругого когерентного рассеяния). В Н. с. используются нейтраны с длиной волны де Бройля  $\lambda \geq 0,3 \text{ \AA}$ .

Рассеяние нейtronной волны на одиночном ядре описывается с помощью т. н. амплитуды рассеяния  $b$ , имеющей смысл амплитуды сферич. волн, испускаемой ядром, если на него падает плоская возбуждающая волна единичной амплитуды. Амплитуда рассеяния зависит от массового числа ядра  $A$ , его заряда  $Z$ , а также от относит. ориентации спинов нейтрана и ядра. Поэтому сумма сферич. волн, рассеянных ансамблем нетождеств. ядер, состоит из слагаемых с разл. амплитудами. В Н. с. важна усреднённая амплитуда  $\langle b \rangle$ , наз. когерентной амплитудой рассеяния. Усреднение амплитуд проводится по спиновым состояниям, изотопному и химическому составу ансамбля ядер, эквивалентных в структурном отношении. Среднеквадратичная флуктуация  $\langle b^2 \rangle - \langle b \rangle^2$  определяет интенсивность некогерентного рассеяния. Интенсивность когерентного рассеяния — дифракции нейtronов зависит от атомной структуры вещества, тогда как интенсивность некогерентного рассеяния к структуре нечувствительна.

Для наблюдения дифракции нейtronов на исследуемый объект (образец) объёмом  $V$  направляют коллимированный пучок нейtronов с волновым вектором  $\mathbf{k}_0$  и регистрируют интенсивность  $I$  рассеянных нейtronов, имеющих волновой вектор  $\mathbf{k}$  той же длины, но др. ориентации ( $k = k_0 = 2\pi/\lambda$ ). Интенсивность является ф-цией т. н. вектора рассеяния  $\mathbf{x} = \mathbf{k} - \mathbf{k}_0$ ,  $x = 4\pi \sin \theta / \lambda$ , где  $2\theta$  — угол рассеяния:

$$I(\mathbf{x}) = |A|^2 = \left| \int_{V} p(\mathbf{r}) \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r}) dV \right|^2. \quad (1)$$

Здесь  $A$  — амплитуда рассеянной нейtronной волны,  $\mathbf{r}$  — пространств. координата точки. Состоиние (1) показывает, что рассеянная нейtronная волна — сумма волн, рассеянных элементарными объёмами  $dV$ , каждая из к-рых имеет амплитуду  $p(\mathbf{r})dV$  и фазовый множитель  $\exp(i\mathbf{k}\mathbf{r})$ ;  $p(\mathbf{r})$  наз. плотностью когерентной амплитуды рассеяния нейtronов. Задачей Н. с. явля-